[안내] 구미전자정보기술원 저활용 연구시설장비 이전 신청

❍ 연구시설장비 이전 절차

단계 (예상 일정)	주요 내용	수행 주체
장비이전 신청 **(2024년 1월~)**	· ZEUS 나눔터 이전 신청(www.zeus.go.kr) · 기술원 방문 및 장비상태 확인	양수기관
장비이전심의위원회 **(2024년 1월~)**	· 장비이전 타당성 검토 · 이전기관 및 이전지원금액 결정	ZEUS
장비이전 **(2024년 1월~)**	· 장비이전(양수기관) 및 공고 종료(GERI)	양수기관
이전장비 사후관리 **(계속)**	· 이전완료 후, 장비활용실적 조사	양수기관

❍ 간략한 이전 순서

① 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr) 나눔터 장비조회(양수기관)

② 구미전자정보기술원 방문 및 장비상태 직접 확인(양수기관)

③ ZEUS 장비활용종합포털에서 해당 장비 이전 신청(양수기관)

④ 이전타당성 검토 및 지원금액 결정(ZEUS)

⑤ 장비이전 및 사후관리(양수기관)

❍ 문의 : ZEUS(1670-0925), GERI(054-479-2177, jhj7@geri.re.kr)

구미전자정보기술원 저활용 연구시설장비 목록(총 51대)

구분	연구시설·장비명	구축연도	장비용도	장비상태 등급
1	디지털방송전송기	2008.02.	디지털 방송과 관련한 모바일 TV 및 디지털 TV의 표준신호 발생기	S
2	무선랜분석기	2006.03.	무선네트워크의 보안 장애원인분석 등 지원	S
3	USB프로토콜분석기	2006.02.	새로운 USB 장비를 테스트할 경우 또는 이미 만들어진 USB 장비의 고장검사	S
4	습식세정장비	2008.03.	소자 공정시 샘플 세척 및 클린닝 공정 수행	B
5	전해연마기	2007.03	금속재료의 표면 처리 용도	B
6	강박시험기	2013.12.	태양광 모듈이 옥외 설치 시 우박 등의 충격에 대한 기계적 강도를 확인하기 위한 목적의 시험장비	C
7	광스펙트럼분석기 (OPI-100M)	2007.02.	LED BLU 및 일반조명기구의 스펙트럼 분석	C
8	부품소재 온도특성 시험분석기	2012.11.	태양전지 모듈의 옥외시험장비	C
9	부품소재 자외선 내구 시험기	2013.04.	태양전지 모듈 및 부품소재에 대해 자외선에 대한 내구성을 평가하는 신뢰성 장비	C
10	부품소재 압력분포 시험기	2013.12.	태양전지 모듈의 외부압력 신뢰성시험용 장비	C
11	잉크젯 전극인쇄기 (Jetlab4)	2014.05.	미세 선폭이 요구되는 패턴을 형성하기 위한 장비	C
12	자기장측정시스템 (480 Fluxmeter)	2006.02.	임의 지점의 자기장의 세기를 측정. 자성체 또는 전자석 주변의 자기장의 세기를 측정	C
13	정션박스 시험기	2013.12.	태양전지 모듈 Bypass 시험장비	C
14	카세트 변환장치	2014.01.	표면구조화 및 PSG제거 시스템, ARC 및 도핑증착 시스템의 카세트에 샘플을 로딩하는 장비	C
15	태양전지 양자효율 측정기 (IQE-200)	2012.10.	태양전지 셀 광전변환 효율 측정	C
16	홀효과측정장비 (HMS-3000)	2007.09.	캐리어 이동도 농도 등 전기적 특성평가	C
17	복합환경진동시험기 (LDS850/440)	2007.08.	부품 및 제품의 복합환경(진동, 온도) 구현을 통해 내구성을 평가하는 장비	C

18	낙하시험기 (AD125A)	2006.02.	포장/수송 등의 유통환경 시 발생할 수 있는 자유 낙하(충격) 환경 구현을 통해 부품 및 제품의 낙하(충격)에 대한 내구성을 평가하는 신뢰성 장비	C
19	염수분무시험기 (DCTC-1200P)	2007.03.	염수 환경구현을 통해 제품 및 부품의 내부식성 (화학적 변화 포함)을 평가하는 기후환경 신뢰성 장비	C
20	온습도챔버-III (TEMI550)	2004.12.	부품 및 제품의 기후환경(온도, 습도, 사이클 시험 등) 구현을 통해 기후환경에 대한 내구성을 (가속수명시험, 고장메커니즘 분석 등) 평가하는 신뢰성 장비	C
21	저진공주사전자현미경 (Quanta 400)	2008.04.	전자현미경을 이용하여 저진공상태에서 표면 형상 분석/성분분석 하는 장비	C
22	고배율현미경 (TM-1000)	2006.11.	저배율에서 고배율까지 측정 가능한 현미경	C
23	피로시험기 (858)	2007.06.	인장 압축 반복시험을 통한 피로 테스트장비	C
24	브리넬경도계 (DTN-600N)	2008.02.	브리넬 압입자를 통한 경도 측정기	C
25	비커스경도시험기 (HV-115)	2007.05.	비커스 압입자를 통한 경도 측정기	C
26	SAR측정시스템	2007.12.	전자기기에서 발생하는 전자파의 인체 흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 시험 장비	C
27	SAR측정로봇 (DASY5)	2007.11.	SAR측정시스템의 보조장비로 전자파의 인체 흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 시험 시 활용됨	C
28	RSE측정시스템	2007.12.	단말기에서 발생하는 불필요한 성분의 주파수를 측정하고 규격치 이상으로 발생되지 않도록 측정 교정하는 장비	C
29	RSE챔버 (ETSI EN 300-328)	2007.09.	RSE측정시스템의 보조장비로, 챔버실 내 단말기를 거치하여 불필요한 성분의 주파수를 측정하고 규격치 이상으로 발생되지 않도록 측정 시 활용됨	C
30	임의파형발생기 (AFG3101)	2008.03.	사인, 사각, 삼각 및 사용자 정의 파형 발생장비	C
31	RF신호발생기 (MG3700A)	2006.02.	다양한 통신 방식의 디지털 변조 신호를 지원하는 신호 발생기	C
32	초순수제조장치	2008.02.	바이오칩 제작공정에서 필요한 초순수를 제조하는 장치	C
33	휘도계	2004.12.	디스플레이 휘도 색도 색온도 등을 측정	C
34	FPD성능평가시스템	2007.10.	표시소자의 명암대조비, 발광 스펙트럼 등 특성평가	C
35	접촉각측정기	2007.02.	디스플레이 반도체 전자재료 코팅재 등의 표면장력을 측정	C

36	전자식별테스트시스템	2008.03	Reader & Tag 초기개발 및 성능향상 수행하는 R&D 통신 프로토콜 분석, 범용 방사파 등 성능분석	C
37	열중량분석기	2005.01.	시료를 승온 냉각 등온 변화시켰을 때 시료의가 흡수/방출한 에너지(열) 무게 변화를 측정하는 기기	C
38	페이스트액성 특성평가장치	2005.01.	Paste 특성분석	C
39	나노인덴테이션	2008.06.	재료의 경도 및 탄성계수 측정	C
40	E-Beam 증착장비	2007.10.	이온빔을 이용한 산화물 및 금속 전극 형성을 위한 박막증착장비 용도로 사용	C
41	콤마 코터	2008.01.	페이스트소재의 성능평가를 위해 닥터블레이드 방식의 후막형성 공정장비로 사용	C
42	고정밀반자동인쇄기	2006.01.	터치스크린 패널제작	C
43	임프린트장비	2009.01.	마스터 몰드를 이용하여 임프린팅 방식을 통해 유전체등의 다양한 패턴을 형성 공정장비로 사용	C
44	레이저패턴장비	2010.08.	PET Film과 Glass 위에 코팅된 박막을 UV 레이저로 건식 식각 하는 설비	C
45	정전기방전시험기 (NSG 438)	2007.04.	임의로 정전기를 발생시켜 시험 대상품의 정전기에 대한 내성 정도를 확인 하는 장비	C
46	서지및버스트시험기 (Modula 6150)	2007.04.	서지 및 버스트 등에 대한 내성정도를 시험하는 장비	C
47	전압및자기장측정시스템 (Modula 6150)	2007.12.	전압 및 자기장 등에 대한 내성정도를 시험하는 장비	C
48	저장용 냉장고 (MPR-1013R)	2007.03.	시료 및 시약 보관기기	C
49	저장용 냉동고 (MDF-U442)	2007.03.	시료 및 시약 보관기기	C
50	OTA챔버 (MIL-STD-285)	2008.02.	OTA측정시스템의 보조장치로 차폐 챔버실 내 시험품 거치를 통해 안테나 특성 측정시 활용	C
51	후방산란전자회절분석기 (INCA Crystal)	2005.04.	국소부위 결정방위 및 결정구조를 분석하는 장비	C

※ 장비상태등급

- S : 현재 정상 사용중으로 이전 후 바로 사용가능
- A : 장비가액의 10% 이내에서 수리 후 정상 작동 확실
- B : 장비가액의 10% 초과 30% 이하로 수리 후 정상 작동 확실
- C : 수리 후 정상 작동 불확실, 부품재활용으로 활용가능